



El Instituto Nacional de Normalización, INN, certifica que:

**DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA,  
DTS SpA**

ubicado en Av. Rodrigo de Araya N°1263, Macul, Santiago

ha renovado su acreditación en el Sistema Nacional de Acreditación del INN, como

**Laboratorio de calibración  
según NCh-ISO/IEC 17025:2017**

en la Magnitud Longitud, con el alcance indicado en anexo.

**Primera acreditación:** 28 de junio de 2003

**Vigencia de la Acreditación** Desde : 13 de julio de 2022  
Hasta : 13 de julio de 2027

Santiago de Chile, 13 de julio de 2022

Este Certificado tiene firma electrónica. Ver última página de este documento.  
Para una adecuada visualización del documento en formato PDF o para su impresión, se recomienda abrirlo utilizando un navegador.

**Eduardo Ceballos Osorio**  
Jefe de División Acreditación

**Sergio Toro Galleguillos**  
Director Ejecutivo



**ALCANCE DE LA ACREDITACION DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA., DTS SpA., SANTIAGO, COMO LABORATORIO DE CALIBRACION**

**AREA : LONGITUD**

Servicio de calibración			Rango del mensurado			Capacidad de medición y calibración (CMC)			Patrón de referencia usado en la calibración	
Instrumento o sistema de medición	Método y Norma/Documento de base	Condición de la medición	Mín (mayor que)	Máx. (menor o igual que)	Unidades	Valor	Unidades	Nivel de confianza	Patrón	Fuente de trazabilidad inmediata
Pie de metro Análogo (Resolución 0,01 mm)	Comparación Directa	21°C± 2°C 50% ± 20% HR	0	1050	mm	8,4+((35·L)/1000)	μm	95%	Set Bloques Patrones	STARRETT (NVLAP 200038-0)
Pie de metro Análogo (Resolución 0,02 mm)	Procedimiento 6752PRO024-01 Rev. 11.00		0	1050	mm	19,4+((30·L)/1000)	μm	95%		
Pie de metro Análogo (Resolución 0,05 mm)	Basado ISO 3599-1976		0	1050	mm	55,5+((17·L)/1000)	μm	95%		
Pie de metro Digital (Resolución 0,01 mm)	Comparación Directa	21°C± 2°C 50% ± 20% HR	0	1050	mm	2,3+((40·L)/1000)	μm	95%	Set Bloques Patrones	STARRETT (NVLAP 200038-0)
Pie de metro Digital (Resolución 0,02 mm)	Procedimiento 6752PRO024-01 Rev. 11.00		0	1050	mm	7,6+((36·L)/1000)	μm	95%		
Pie de metro Digital (Resolución 0,05 mm)	Basado ISO 3599-1976		0	1050	mm	5,8+((25·L)/1000)	μm	95%		

Servicio de calibración			Rango del mensurando			Capacidad de medición y calibración (CMC)			Patrón de referencia usado en la calibración	
Instrumento o sistema de medición	Método y Norma/Documento de base	Condición de la medición	Mín. (mayor que)	Máx. (menor o igual que)	Unidades	Valor	Unidades	Nivel de confianza	Patrón	Fuente de trazabilidad inmediata
Micrómetro Exterior Análogo (Resolución 0,01 mm)	Comparación Directa  Procedimiento 6752PRO021-01 Rev. 12.00  Basado Nch2518.of2000 NORMA JISB7502-2016	21°C ± 2°C 50% ± 20% HR	0	1050	mm	5,8+((8,9·L)/1000)	μm	95%	Set Bloques Patrones	STARRETT (NVLAP 200038-0)
Micrómetro Exterior Análogo (Resolución 0,001 mm)			0	300	mm	0,98+((10,6·L)/1000)	μm	95%		
Micrómetro Exterior Digital (Resolución 0,001 mm)			0	300	mm	0,44+((12,2·L)/1000)	μm	95%		
Micrómetro Interior Análogo (Resolución 0,01 mm)			2	1050	mm	6,7+((15·L)/1000)	μm	95%		
Micrometro Profundidad Análogo (Resolución 0,001 mm)			0	300	mm	1,1+((4,5·L)/1000)	μm	95%		
Micrometro Profundidad Análogo (Resolución 0,01 mm)			0	1050	mm	5,5+((10·L)/1000)	μm	95%		
Comparadores Análogos (Resolución 0,01 mm)	Comparación Directa  Procedimiento 6752PRO023-01 Rev. 7.00  Basado 33K6-4-889-1 ISO/R463-2006	21°C ± 2°C 50% ± 20% HR	0	25	mm	2,97	μm	95%	Banco de calibración para comparadores	STARRETT (A2LA 760.01)
Comparadores Digitales (Resolución 0,01 mm)			0	25	mm	2,97	μm	95%		

L: corresponde a la longitud efectiva del instrumento de referencia, expresada en unidades de longitud.

RESERVADO CABECERA FIRMA DIGITAL

RESERVADO PARA FIRMA ELECTRONICA - SIGN

RESERVADO PARA FIRMA ELECTRONICA - SIGN